第３回 国際標準化対応支援委員会／運営委員会　国際会議出席報告書

資料 No.	＜SC3D 関係＞国際会議報告書
3-3／SC3D-①	SC3D「電子部品のデータ要素」指宿会議　出席報告書
資料 No.	＜TC40 関係＞国際会議報告書
3-3／TC40-①	TC40 Part C 及び Filter 及び Part R、WG36 及び WG39 MT60115-1,-8、MT60384-1,-14「電子機器用コンデンサ及び抵抗器」ヘルシンキ・フランクフルト会議報告書 20070613-20070621
資料 No.	＜TC47 関係＞国際会議報告書
3-3／TC47-①	TC47/WG2「半導体環境試験方法」シンガポール会議報告書 20070607-20070607
3-3／TC47-②	TC47/WG5「半導体故障メカニズム」ナイメヘーン会議報告書 20070628-20070629
3-3／TC47-③	TC47/PT62258「半導体デバイスベアダイプロジェクト」ポーツマス会議報告書 20070627-20070628
資料 No.	＜SC47E 関係＞国際会議報告書
3-3／SC47E-①	SC47E/WG2「個別半導体／マイクロ波デバイス」北京会議報告書 20070625
3-3／SC47E-②	SC47E/WG3「個別半導体／パワーデバイス」ニュルンベルク会議報告書 20070625-20070627
資料 No.	＜SC62A 関係＞国際会議報告書
3-3／SC62A-①	SC62A/JWG5「生体閉ループコントローラ」ボストン会議報告書 20070418-20070420
資料 No.	＜SC62D 関係＞国際会議報告書
3-3／SC62D-①	SC62D/MT18「医用電子機器／診断機器」ライデン会議報告書 20070704
3-3／SC62D-②	SC62D/JWG7「医用電子機器／非観血血圧計」ミラノ会議報告書 20070618-20070622
資料 No.	＜TC80 関係＞国際会議報告書
3-3／TC80-①	TC80/WG6「デジタルインターフェース」ストックホルム国際会議報告書 20070626-20070629
資料 No.	＜TC91 関係＞国際会議報告書
3-3/TC91-①	IEC/TC91 WG-Mtg.シンガポール会議出席報告　(西山) 20070607-20070608
3-3/TC91-②	TC91/WG3 シンガポール会議報告(春日)　20070607-20070608
3-3/TC91-③	TC91/WG3 と TC47/WG2 合同シンガポール会議報告（春日）20070608
資料 No.	＜TC100/TA5 関係＞国際会議報告書
3-3／TC100/TA5-①	TC100/TA5「ケーブルネットワーク」東京会議報告書 20071008-20071012
資料 No.	＜TC110 関係＞国際会議報告書
3-3／TC110-①	TC110/WG2「フラットパネルディスプレイ／液晶ディスプレイ」ロングビーチ会議報告書 20070525－20070527
3-3／TC110-②	TC110/WG4「フラットパネルディスプレイ／プラズマディスプレイ」ロングビーチ会議報告書 20070526－20070527
3-3／TC110-③	TC110/WG5「フラットパネルディスプレイ／有機ＥＬディスプレイ」ロングビーチ会議報告書 20070525－20070527
資料 No.	＜SC31 関係＞国際会議報告書
3-3／SC31-①	SC31、SC31/WG2、WG4、WG4/SG5「自動認識及びデータ取得技術」プレトリア会議報告書 20070606-20070608
3-3／SC31-②	SC31/WG4/SG1「自動認識及びデータ取得技術」葉山町会議報告書　20070718-20070720

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／SC3D-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日：2007年8月6日

（報告者記載）整理番号：H19SC3D①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：南野　典子　報告書作成者氏名：南野　典子　（会社名）（株）東芝

出席会議名(半角)	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC3D (半角)
SC3D/WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
SC3D/WG2 JWG	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	電子部品のデータ要素
open forum	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2007年7月3日 ～ 2007年7月5日		
開催場所	（国名）日本	（都市名）鹿児島県指宿市	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Addie Dijkstra	幹事国　オランダ	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 日、英、蘭、独、参加人数（17）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA電子)] 堀内一(東京国際大学)、南野典子(東芝)、佐藤一巳(ソニー)、村山廣(東芝)、本田敏郎(ソニー)、ジョンマッキン(RNJ)、高橋満(日立)、荒木純夫(VPI)、石川敦(JEITA)、三谷脩(JEMIMA)、谷部貴之(JEMA)、大和久吾郎(JEMA)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

今回は、リエゾン関係が深いISO TC184/SC4と同時期同所で開催した。ISO/SC4/WG2とSC3D/WG2は一部出席者が重なってはいるが、どちらか一方にのみ出席しているメンバーも多い。それぞれ年に三回、欧米を中心に会議を開催するため、特に日本人にとっては両方の会議への出席は難しかった。今回の日本開催では、多くの関係者が一堂に会し、有意義な会議を行うことができた。以下、各会議についての報告を行う。

【SC3D/WG2】

・IEC61360-4（電気電子部品の辞書）に対するCR（Change Request）：

設置環境に関するプロパティの提案であるCR9については、3月のEvaluationで否決されていたが、その後の取り扱いについてはまだ決められていない。今回も意見がまとまらず保留となった。また、TC47からの案件（CR10-12）についても議論があり、TC47のメンバーでもあるSC3D議長がもう一度説明資料を用意することになっている。なお、本Evaluationの〆切りは7月25日。

・データベース規格の多言語化：

TC3として対応していくことになっていたが、IEC61360-4についてもドイツ語でのテストサイトが作成され、今回紹介された。

・幹事国の交代

オランダが幹事国を降りることになり、次の幹事国の募集が行われていたが、立候補がドイツからあり、現在、信任投票中であることが紹介された。（会議終了後、日本は賛成で投票。）

【SC3D/WG2 JWG】

ISO TC184/SC4/WG2とのJWG。ISO側からISO/IECダブルロゴ規格のデータモデルの分冊ISO13584-42/IEC6136-2のEdition2のDIS版の準備を行っている。今回はDIS版とCD版との相違点の紹介が行われた。IEC側からもデータモデルについては数点リクエストを提出した。その他、辞書のメンテナンス（各辞書要素のステータス）、辞書の妥当性検証方法、交換フォーマット、コピーライトについて、時間が限られていたため議論は控え、情報交換を中心におこなった。また、今後の両WGの会議方針として、それぞれ年三回ある会議のうちの一回については、合同で行うことで合意した。SC3D/WG2の場合は、三回のうちの秋の会議はIEC総会と同時開催のため、それ以外の5月或いは2月を合同会議に充てる。

【辞書オープンフォーラム】

辞書のメンテナンス、コピーライトの問題を中心に発表が行われた。発表はISO/CSの猿橋氏のほか、IEC/SC3D辞書メンテナンス、日本発の計測器規格ISO13584-501のRA（Registration Authority）による辞書メンテナンス、JEITA/ECALS、等々からの発表が行われた。ISOでは辞書については無償配布・利用を可能とする方向で進んでいる。

次回のIEC/SC3Dは、TC3と同時開催、11月にパリで行われる。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／TC40-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日：2007 年 6 月 25 日

（報告者記載）整理番号：
H19TC40①、②、③、④、⑤、⑥

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：青木　仁　報告書作成者氏名：尾村　博幸　（会社名）日本ケミコン

出席会議名(半角)	区　分	組織番号(TC/SC/TA)	TC40 (半角)
TC40 Part C 及 Filter 及び Part R	☒TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
WG36 及び WG39	☐TC ☐SC ☐TA ☒WG ☐PT ☐その他	名　称(日本語)	電子機器用コンデンサ及び抵抗器
MT60115-1/-8	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☒その他		
MT60384-1,-14	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☒その他	☐単独開催 ☒同時開催	
開　催　期　日	2007 年 6 月 13 日 ～ 2007 年 6 月 21 日		
開　催　場　所	(国名) フィンランド，(ドイツ)	(都市名) ヘルシンキ，(MT60115-1/-8;ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ)	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	TC40 及び WG36；Friedrich，WG39；Huck	幹事国　オランダ	
参加国及び参加人数	11 ヶ国、主な国名 米，独，英，仏，蘭，フィンランド，韓、日、参加人数（32）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○近藤隆則(村田製作所)，○尾村博幸(日本ケミコン)，○青木仁(KOA)，○大島寛(ニチコン)，○池上孝(太陽誘電)，○中村一重(ルビコン)，土生正(村田製作所)，○笠原良雄(岡谷電機産業)，○和田友英(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ)，○中村幸二郎(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ)，○楢岡浩喜(松下電器産業)，○上村(住友ｽﾘｰｴﾑ)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

1. MT60115-1/-8(固定抵抗器 GS 及び SS)(6/13-15)

(1)宇宙，自動車などの特殊用途を含めることがドイツから提案あり，3 日間に渡って日独で調整したが，明確な結論に至らなかった。方針を WG39 及び Plenary 会議に委ねた。

2. MT60384-1(固定ｺﾝﾃﾞﾝｻ GS)(6/19)

(1)CDV に対する日独コメントの調整を行った。基本的な合意がすべてできた。定格静電容量→公称静電容量など

3. MT60384-14(電磁障害防止用ｺﾝﾃﾞﾝｻ SS)

(1)定格電圧：ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾌﾞへの用途拡大を狙った 1 000V までの拡大は，基本的に受け入れる。

(2)耐火性：IEC 60695-11-5(ﾆｯﾄﾞﾙﾌﾚｰﾑ試験)による耐炎性ｶﾃｺﾞﾘ C→B までの拡大の他に，UL94(材料の耐火性)及び UL224(筒ﾁｭｰﾌﾞの耐火性)を導入する提案は，基本的には受け入れるが次の CD の段階で再検討する。耐火性の規格が取り入れられる場合には，TC89(耐火性)の規定内容に転換する。

4. WG36(自動実装用容器包装)(6/18)

(1)極小部品のﾌﾟﾚｽｷｬﾘｱﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ，W4P1 ｴﾝﾎﾞｽｷｬﾘｱﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ：部品収納部内のﾄﾚﾗﾝｽ及び傾きなどの指摘があるため，2ndCDV を発行し，再度審議する。

(2)IEC 60286-3(SMD ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)：極小部品のﾃｰﾋﾟﾝｸﾞの規定内容を含めた統合規格にする。ただし，規格化が完了していないため，完了した段階で再度構成案を検討する。

(3)トレイ：半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽの寸法に合わせたトレイ寸法修正に対する日本提案が受け入れた。

5. WG39(品質認証及び GS の整合化)(6/19)

(1)タイトルの変更：品質認証＋GS 間の整合

(2)品質認証の事項を附属書 Q に移す。ことときに，QA(品質認証)及び CA(能力認証)に TA(技術認証)を追加する。

(3)GS の共通事項を整合化した。

6. Plenary Part Capasitor& Filter 及び Resistor&General 会議(6/20-21)

(1)MT60115-1/-8(固定抵抗器)，MT60384-1(固定ｺﾝﾃﾞﾝｻ)及び MT60384-14(電磁障害防止用ｺﾝﾃﾞﾝｻ))報告

(2)WG36(自動実装容器包装)報告及び Item 9(Activities of the other TCs(TC91,TC104)報告

(3)TC69JNC から TC69 に対して EDLC for use in Hybrid-EV を 10 月又は 11 月に提案することに対して，TC40 から TC69 に対してリエゾン関係を要請する。IEC TC69JNC の活動状況を報告した。この件を承認した。

(4)TC40 に関連する IEC 規格と JIS との整合化状態及び規格番号体系を説明した。EN からも同じ説明があった。

(5)日本からのリード線端子部品及び SMD の低 ESL 測定方法に対して，いずれも CDV 及び CD に進むことになった。
(6)ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻの規格文書に対して，日本からテクニカルな内容であるが，明らかな間違いがあるため，Corrigendam の発行を求めたが，テクニカルな事項があるため，DC→CDV→IS の段階を取り，途中の段階を省略する。
(7)リード端子形のアルミニウム導電性高分子コンデンサの規格を 2008 年 3 月までに IEC への日本提案を公表した。
(8)Review of SPS：リエゾン TC に，TC69 を追加する。
(9)IEC 1906 賞；2008 年度受賞内定者が公表された。；近藤委員長，青木幹事他
(10)次回以降の会議開催 2008 年日本札幌，2009 年フランス？，2010 年米国

［注］：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後 1 週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC47-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　　　提出日：2007 年 6 月 28 日

（報告者記載）整理番号：H19TC47⑤

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：田中政樹　報告書作成者氏名：若井伸之　（会社名）東芝

出席会議名（半角）	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC47/WG2（半角）
TC47/WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	半導体環境試験方法
		☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 7 日 ～ 2007 年 6 月 7 日		
開催場所	(国名) シンガポール	(都市名) シンガポール	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	英国	幹事国　韓国	
参加国及び参加人数	3ヶ国、主な国名 英国、米国、日本、参加人数 (5)		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者・・（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○若井伸之(東芝)　和田哲明(松下)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

TC47WG2：1.落下試験,2.CDM,3.ESD,4.半田耐熱,5.SER,6.HBM-TLP の規格化状況について討議実施。　1.落下試験：60749-38 は CDV が完了している事を確認。日本からコメントで提案してた歪みゲージを使用する方法について、現審議文書に取り込む事は内容の構成上難しいため、60749-40 で単独の試験方法と"歪みゲージを使用した落下試験方法"して標準化を進めていく事にした。また、歪みゲージ法自体は落下試験以外にも適用できる要素があり、その参照の仕方含めて日本にて内容を作成して提出を進めていく事となった。また、落下試験方法での混乱を防ぐため、60749-38 は加速器(Acceleometer)の言葉をタイトルにつける事で使い分けをしやすくしていく事で合意した。　2.CDM は Direct-Contact(DC)と Field-Induced(FI)の 2 手法内容の共存する内容の検討を前回までに続けてきたが、内容の共有化が厳しい状況にあり、60749-28 にて共通項目の定義を行い、60749-28-1 で DC 法を 60749-28-2 で FI 法の手順を標準化する方向で合意した。日本提案の DC 法は日本が PJL となって文書作成を進めていく事とした。3.ESD は HBM と MM の改訂作業を開始する事をコンビナーから提案され、日本側が両規格とも進める旨了解された。特に現 Ed.2.0 で反映されなかった日本から提案していた技術的なコメントを反映させた内容を提案していく事も了解された。ただし、TC101 との間で調停された内容は変更できないため、TC47/WG2 で変更の出来るデータの取り扱い等の項目で変更を進め、提案する文書作成を進めていく。　4.半田耐熱は、今までに確認を進めてきた半田のピーク温度(～260℃)および吸湿条件の変更を反映させて、CDV 文書として提出された旨報告があった。　5.SER は CDV 文書に対する各国のコメントをレビュー。大半が用語、語句に対する Editorial なコメントであり席上回答内容の確認を行い、それらの内容を反映させて FDIS 提出文書の作成を進める事で合意した。6.HBM-TLP は TC101 から TC47/WG2 での審議をリクエストされ、その方針を討議実施。TC101 での審議方針が不明瞭の所もあり、次回必要があれば審議していく事に。※すでに IS 化されている 60749 の各試験項目も更新の必要性は順次確認していく　※上記に加え、TC91/WG3 とのジョイントミーティングも行われ、落下試験をはじめとする双方の標準化作業の内容確認を行った。　次回 2007 年 11 月はトゥールーズ(仏)、2008 年 5 月はアトランタ(米)で行う。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会 知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC47-② （事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日: 2007 年 8 月 8 日

（報告者記載）整理番号：H19TC47⑦

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：田中政樹　報告書作成者氏名：松山英也　（会社名）富士通

出席会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC47/WG5（半角）
TC47/WG5	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他 □TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称（日本語）	半導体故障メカニズム
		☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 28 日 ～ 2007 年 6 月 29 日		
開催場所	（国名）オランダ	（都市名）ナイメヘーン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Jaap Bisschop	幹事国 オランダ	
参加国及び参加人数	2ヶ国、主な国名 オランダ、日本、参加人数（4）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○若井伸之(東芝)、○松山英也(富士通)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

TC47/WG5では半導体の故障メカニズムに特化したTEGによる信頼性試験方法を標準化作業中である。日本から提案しているIEC62374-1:IML-TDDB(NP 承認)に加えて、 IEC62415:EM(NP), IEC62416:HCI(NP), IEC62417:MobileIon-NP, IEC62418:SIV(NP)が現在進められている、各国のコメントを審議し回答を作成した。それらをもとに各 document を NP、CD への進めた。日本提案のIEC62374-1:IML-TDDB(配線間のTDDB評価)もCD案を決定Central officeへ提出予定。IEC62415:EMは日本がProject Leaderを引き受けることになり、Documentを案を決めた。再NPをCetral Officeへ提出、8/3よりcirculation開始、他の文書もCD内容を決定しCentaral Officeへ提出済である。

[注]： 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会 知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル） Tel：03-3518-6435 Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC47-③（事務局記入）

国際標準化対応支援委員会　御中　　　　提出日：2007 年 8 月 10 日

（報告者記載）整理番号：H19TC47②

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：田中政樹　報告書作成者氏名：永広祐一　（会社名）（株）東芝

出席会議名（半角）	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC47/PT62258（半角）
TC47/PT62258	□TC □SC □TA □WG ☒PT □その他	名　称（日本語）	半導体ベアダイプロジェクト
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催　□同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 27 日 ～ 2007 年 6 月 28 日		
開催場所	（国名）英国	（都市名）ポーツマス	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	J.Walbert(JEDEC)	幹事国 USA	
参加国及び参加人数	4ヶ国、主な国名 米／英／独／日、参加人数 (9)		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者・・・（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○ 永広祐一（株）東芝		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

１．背景：　ベアダイに関するＩＥＣ規格を作成するプロジェクトチームが２００１年1月に承認され、欧州のベアダイ仕様ＥＳ５９００８をベースに米国／日本の意見を取り入れる形で国際版ドラフトを作成中である。

２．目的：　規格の目的はベアダイを調達する際にダイサプライヤーとダイユーザーの間でどのようなデーターをどのような形式で交換するかを示したもので、最低要求事項を定義している。規格の構成は現在7つのパートに分かれており、パート１．(ﾍﾞｱﾀﾞｲ)調達と使用のための必要条件、２．取り交わしのデーター形式、３．(半導体チップの)取扱い／包装／保存の上手な実践のための推奨条件、４．ベアダ使用者と供給者の(間の)質問調査表、５／６．電気的／熱的シミュレーションに関しての(入力)情報の必要条件、７．ﾃﾞｰﾀｰ交換のXML-schemaで構成されている。

３．成果：　パート１については、従来の討議内容ベースでメンテナンスCDとし、ＩＥＣ本部に送付した。
パート４、７については、最終案として全体的な修正を行い、Final Edit 版として本部へ送付可能とした。
パート４，７の修正内容は、このPjの大元のスタンダードであるパート１，２とリンクさせるように、項番号の整理、使用する用語の統一や一部追加（ＩＥＣ６１３６０の用語集から）など。
メンテナンス作業としては、パート２，３についても４，７と同様の作業を実施した。
今回、文章校正やスタンダードとしての統一感を出すための作業が主であり、技術的な問題はありませんでした。

次回；１１月６日　Toulouse(France)

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WGがTC/SC/TAと同時開催の場合は、WG会議内容はTC/SC報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITAホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／SC47E-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日: 2007 年 7 月 3 日

（報告者記載）整理番号：H19SC47E⑧

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：石井　一史　報告書作成者氏名：大芝　克幸　（会社名）ソニー㈱

出席会議名(半角)	区　分		
SC47E/WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他	組織番号 (TC/SC/TA)	SC47E (半角)
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名 称 (日本語)	個別半導体/マイクロ波デバイス
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 25 日 ～ 2007 年 6 月 25 日		
開催場所	(国名) 中国	(都市名) 北京	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	コンベナ: 大芝　克幸(SC47E/WG2)	幹事国　韓国	
参加国及び参加人数	2ヶ国、主な国名 中国、日本、参加人数（13）		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者・・・（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 大和田邦樹(帝京大)、高島和希(熊本大)、○大芝克幸(ソニー)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

中国側事務局の CESI(China Electronics Standardization Institute)からの参加者も含めて 13 名の参加があった。
昨年 10 月のロンドン会議からの文書進捗確認と新規メンテナンス文書の審議、NP 文書の投票結果レビューと測定項目追加検討を行った。IEC60747-16-2, 60747-16-3, 60747-16-4 の各メンテナンス文書は、いずれも修正無く回付することが合意された。

1.コンビナ交代　今回より、大和田(5 月に SC47E チェアマンに就任)に代わり大芝がコンベナを務めた。

2.文書審議

2.1　60747-4 Ed.2 (個別ﾏｲｸﾛ波ﾃﾞﾊﾞｲｽ)
現在 47E/330/FDIS が投票期間中(7/27 締切)。日中とも確認作業中で、現時点では修正コメント無し。

2.2　60747-16-2 Ed.1 Am.1 (ﾌﾟﾘｽｹｰﾗ)
47E/325/RVC の投票結果およびｺﾒﾝﾄのﾚﾋﾞｭｰと、FDIS 案での追加修正箇所を審議。修正無し。

2.3　60747-16-3 Ed.1 Am.1 (周波数変換器)
MCR 案のスケジュールおよび CD 案の修正内容を個々に審議。修正無し。

2.4　60747-16-4 Ed.1 Am.1 (ｽｲｯﾁ)
MCR 案のスケジュールおよび CD 案の修正内容を個々に審議。修正無し。

2.5　60747-16-5 (ﾏｲｸﾛ波発振器)
NP 文書投票結果 47E/327/RVN およびｺﾒﾝﾄのﾚﾋﾞｭｰと、追加項目案を審議。投票期日がクリスマス直前(12/22)だったため、投票が低調でエキスパートが 2 ヶ国しか獲得できず否決された。3 回目の提案を目指し準備中。
RVN ｺﾒﾝﾄ以外の新たな追加項目として「変調周波数帯域幅」を検討することになった。中国提案の追加項目 7 件の一部を中国 NC で作業するように提案し、持ち帰って検討して貰うことになった。

3.次回は、2007/11/5～9 の SC47E 会期中に開催。場所は、仏 Toulouse。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後 6週間以内 に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局: (社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11 (三井住友海上別館ビル)　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　運営委員会・資料番号：3-3／SC47E-②（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日：2007 年 7 月 10 日

（報告者記載）整理番号：H19SC47E⑨

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：石井　一史　報告書作成者氏名：古賀　健司　（会社名）(株)日立製作所

<table>
<tr><td>出席会議名（半角）</td><td colspan="2">区　分</td><td>組織番号
(TC/SC/TA)</td><td>SC47E（半角）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SC47E/WG3</td><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　☒WG　□PT　□その他</td><td rowspan="3">名　称
(日本語)</td><td rowspan="3">個別半導体/パワーデバイス</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td><td colspan="2">☒単独開催　□同時開催</td></tr>
<tr><td>開 催 期 日</td><td colspan="4">2007 年 6 月 25 日 ～ 2007 年 6 月 27 日</td></tr>
<tr><td>開 催 場 所</td><td>(国名) ドイツ</td><td colspan="3">(都市名) ニュルンベルク</td></tr>
<tr><td>ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ</td><td>コンベナ：古賀　健司(SC47E/WG3)</td><td colspan="3">幹事国　韓国</td></tr>
<tr><td>参 加 国及び
参 加 人 数</td><td colspan="4">3ヶ国、主な国名 英国、ドイツ、日本、参加人数 (8)</td></tr>
<tr><td>日　本　人
出席者名 (会社名)</td><td colspan="4">[○：補助対象者･･･ (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)]
○古賀健司(日立)、○宮下秀仁(富士)、○樋口泰之(ローム)</td></tr>
</table>

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

背景・目的：60747-7Ed3(BTR), 60747-8Ed3(FET), 60747-15Ed2(Isolated Power Semiconductor Devices)
それぞれの CD に対する各国コメント審議。

成果と課題：

1．60747-9Ed2(IGBT)：FDIS 確認
フランス語訳版が4月に終了し、間もなく FDIS が発行されることを確認した(6/29 に発行された)。

2．60747-7Ed3(BTR)：CD コメント審議(抵抗内蔵型トランジスタ含む)
本件は closing date for comments が 2007/7/13 であり、〆切が来ていないが集まる時間がないこと及び今回参加している英独日の3ヶ国のコメントは出揃っていることから3ヶ国分の審議を行った。記号、表現の統一、参照文献の最新版化等を行った。本規格はパワーデバイスだけでなく、小信号および抵抗内蔵型トランジスタも入れており、多岐に渡る表現統一が課題である。

3．60747-8Ed3(FET)：CD コメント審議
47E/320/CD の各国コメントにつき審議を行った。本件の各国投票結果は投票国 10 ヶ国。コメント付は3ヶ国(英独日)。コメント総数は 113 項目。記号、表現の統一、参照文献の最新版化等を行った。

4．60747-15Ed2(Isolated Power Semiconductor Devices)：CD コメント審議
47E/322A/CD の各国コメントにつき審議を行った。本件の各国投票結果は投票国 9 ヶ国。コメント付は3ヶ国(英独日)。コメント総数は 166 項目。本件は JEC-2407 "絶縁型パワー半導体モジュール"と整合を取るため、多数の日本コメントを提出している。基本的に読者が分かり易くと言う考えで、モジュール内の回路図等より具体的な提案を行っているが、余り賛同が得られていない状況。なお、今回の会議では時間が足らず、測定法以下は次回に持ち越すことになった。

5．Future Strategy 審議
特に現在の所、新しい動きなし。表に掲載の"New Applications of IGBT"や"New material devices (SiC, GaN, etc.)"等については、一旦外すことにした。

6．次回の WG3 会議について
2007/7/30～31 の2日間開催する。場所はフランクフルト。
47E/322A/CD(60747-15Ed2)の各国コメントについて、未審議分を集中審議する。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号： 3-3／SC62A-① (事務局記入)

国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日: 2007 年 5 月 30 日

（報告者記載）整理番号：H19SC62A⑭

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名: 市川義人　報告書作成者氏名: 中谷　敬　(会社名) 日本光電工業

出席会議名(半角)	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC62A (半角)
SC62A/JWG5	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名 称 (日本語)	生体閉ループコントローラ
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開 催 期 日	2007 年 4 月 18 日 ～ 2007 年 4 月 20 日		
開 催 場 所	(国名) アメリカ	(都市名) ボストン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Dr. Julian Goldman	幹事国 アメリカ	
参 加 国 及び 参 加 人 数	3ヶ国、主な国名 アメリカ、ドイツ、日本、参加人数 (7)		
日 本 人 出席者名 (会社名)	[○：補助対象者･･･ (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○ 中谷 敬 (日本光電工業株式会社)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）(この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

EC/SC62A と ISO/TC121/SC1&SC3A の Joint Working Group (JWG5)で、生体閉ループコントローラ(PCLC)に関する安全通則の副通則 IEC60601-1-10 の制定作業が進んでいる。今回の会議の目的は、配布された CDV に対する各国のコメントを審議し、ＦDIS 案を作成することであった。国内 JWG5 主査の中谷が会議に出席した。会議の概要は次のとおりである。

(1) CDV/DIS 投票結果は、IEC、ISO 共に承認され、コメント審議の結果、FDIS 案が作成された。

(2) FDIS 発行は 2007 年 9 月の予定。2 ヶ月の投票期間の後、IS として発行される予定。

(3) この副通則は、製品そのものの安全性を規定するのではなく、開発プロセス(特に verification、validation)を規定することにより、製品の安全性を確保しようとするものである。生体閉ループコントローラは、日本では勿論、世界的にも商品化されているものはほとんどない。欧米諸国の意図は、この規格制定により PCLC の開発を促進し、各国規制当局からの承認を得易くすることにあると思われる。

(4) 国内 JWG5 の討議を基に、日本は賛成投票した。国内での商品化の例が無く、馴染みの無い医療機器を規定する規格のため、PCLC に対する理解を深めるための内容補強を主眼とする次のようなコメントを提出し、ほとんどが採用された。

・PCLC システムの例を、生体変数(心電図、血圧、パルスオキシメトリなど)とアクチュエータ(人工呼吸器、麻酔器、輸液ポンプなど)の組み合わせで表にまとめる。

・PCLC システムの応答に関して、新たに周波数応答、ヒステリシス、サンプリング時間などに関する記述を追加。

・PCLC システムの応答は非線形のことが多いため、これに起因する問題に対すしての注意喚起。

(5) この規格は、PCLC 開発プロセスを規定するため、PCLC の validation に関する規定が大きな比重を占めている。カナダから validation は人を使った試験によるべきとのコメントがあった。CDV では、文献調査、動物実験、実験室でのシミュレーションでも良いとしているが、PCLC 開発の現状を考えて修正しないことになった。

(6) フィンランド、カナダ、スウェーデンは、コメント付き反対であった。特に、スウェーデンのコメントは、不要に副通則を増やす必要が無いと言う趣旨のものであった。しかし、この規格はPCLC に固有の安全性を規定するものであると言う観点から、事務局意見が作成され、回答とした。

(7) その他の各国のコメントは、CDV の内容を大きく変更するものでなく、会議の後半は FDIS としての体裁を整えることに主眼が置かれ、条文の細かなチェックを行なった。

以上

[注： 1. 該当者は、出席会議終了後「6週間以内」に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局: (社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11 (三井住友海上別館ビル)　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／SC62D-①（事務局記入）　　様式 4

国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日：2007年 7月 30日

（報告者記載）整理番号：H19SC62D⑦

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：内藤 正章　報告書作成者氏名：岸本 眞治　（会社名）日立メディコ

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC62D (半角)
SC62D/MT18	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称 (日本語)	治療機器
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	200 年 7月 4日 ～ 200 年 7月 4日		
開催場所	（国名）オランダ王国	（都市名）ライデン市	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Dr. Kok-Swang TAN	幹事国　カナダ	
参加国及び参加人数	5ヶ国、主な国名 蘭、英、独、米、日、参加人数（6）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○ 岸本眞治(日立メディコ)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

背景

2005年にIEC 60601-1 医用電気機器─第1部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項、の第三版が発効し、該規格に従属する個別安全規格はすべて整合を求められている。 昨2006年10月のTC62デルフト会議で、”2008年2月までにCDが発行されない個別規格は該日時に廃止とする”旨決定された。 SC62D/MT18 は、治療機器の個別規格のメンテナンスが役務であり、ライデン市のTNO（オランダ応用科学研究機構）において国際会議を開催し、IEC 60601-2-5 医用電気機器─第2-5部：超音波物理療法機器の安全性の特定要求事項 を集中審議した。

成果

出席者のうち従来のMT18メンバーは1名のみで、他は新規にリクルートしたTC87からのメンバーとオブザーバーで、事前配布した原案へのコメント集について逐次審議した。

・有効照射領域 Aer、等々の定義 は改訂済みの IEC61689 に合致させた。
・IEC 規格に合致している装置では、今後無効化予定の FDA 関連の米国規格に従う必要性は見出せなかった。
・IPX7 に従うべき水密性は、0.15 ～1 mの水深において、とした。
・照射強度表示値の誤差に関し、AER の誤差を追加し、照射強度の不確実性の要求を示を削除した。
・MT18 は、患者安全に関し規格で定義された以上の過剰な要求には同意しなかった。

問題点など

審議しきれなかった仕事は有力メンバーに割振って、文書審議する事とした。

・ハイドロフォンの特性とパワー算出方法：　ヘッケンベルグ（TNO）
・Aer の許容範囲の追加：　同上
・EMC 関連事項の修正：　ウィルトン（EMS physio 社）

この残務処理を7月末までに完了し、8月にCD発行を目指す事とした。 これにてIEC 60601-2-5 が廃止される事を防止できると判断する。

以上

[注]： 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／SC62D-②（事務局記入）　　様式 4

国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日：2007 年 8 月 2 日

（報告者記載）整理番号：H19SC62D⑮

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：内藤　正章　報告書作成者氏名：　兵後充史　（会社名）日本光電工業(株)

<table>
<tr><td>出席会議名(半角)</td><td colspan="2">区　分</td><td>組織番号
(TC/SC/TA)</td><td>SC62D/JWG7(半角)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SC62D/JWG7</td><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　☒WG　□PT　□その他</td><td rowspan="3">名　称
(日本語)</td><td rowspan="3">自動式非観血血圧計</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td></tr>
<tr><td colspan="2">□TC　□SC　□TA　□WG　□PT　□その他</td><td colspan="2">☒単独開催　□同時開催</td></tr>
<tr><td>開催期日</td><td colspan="4">2007 年 6 月 18 日 ～ 2007 年 6 月 22 日</td></tr>
<tr><td>開催場所</td><td>(国名) イタリア</td><td colspan="3">(都市名) ミラノ</td></tr>
<tr><td>ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ</td><td>Dr. S. Mieke/ D. Osborn</td><td colspan="3">幹事国　ドイツ</td></tr>
<tr><td>参加国及び
参加人数</td><td colspan="4">8ヶ国、主な国名 アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、スロベニア、日本、参加人数 (27)</td></tr>
<tr><td>日本人
出席者名(会社名)</td><td colspan="4">[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)]
白崎修(オムロンヘルスケア)、尾田欣士(松下電工)、○兵後充史(日本光電)</td></tr>
</table>

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

ISO/TC121/SC3 と IEC/SC62D の Joint Working Group (JWG7)で、次の個別規格制定作業が進んでいる。

(1)ISO IEC 80601-2-30 MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –Part 2-30: Particular requirements for basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers

(2)ISO IEC 81060-2 :Non-invasive sphygmomanometer – Clinical validation of automated measurement type

今回の JWG7 の会議では、配布されたドラフトに対し各国より寄せられたコメントについて討議し、80601-2-30 については DIS 案、81060-2 については CD 案をまとめた。

[主な討議内容と討議結果]

(1) 80601-2-30　自動式血圧計の安全・基本性能規格

- 防水性について：『Keep dry』マーク(ISO15223 No.3.8)を表示しない機器については IPX2 を要求
- 電池切れ時のテクニカルアラームについて：自動繰返し式の装置のみ対象とする。
- 単一故障時の安全性について：自動繰返し式の装置に対してのみ対象とする。
- 取扱説明書に記載する測定手順について：高血圧診断を意図する装置のみ対象とする
- 短周期繰り返しモードの休止時間、継続時間：従来どおり、休止期間 2 秒以上、継続時間 15 分未満とする
- 聴診法採用時の圧力降下速度について：圧力降下速度の要求は削除する

・審議結果を反映した DIS を ’07/11 までに発行し、投票・コメントを ’08/2 締切りで募集する予定。

(2)81060-2 自動式血圧計の臨床評価基準

- 統計に関わる事項：聴診法基準ではデータ数 255 以上(被験者数 85 名以上、2 回以上/1 名測定)
  小児は特殊被験者群とし、85 名とは別に 35 名以上のデータをとる。
- データ解析に関わる事項：ANSI/AAMI　SP-10 の method-1,method-2 の両方を満たすこと
- 被験者について：糖尿病患者は特殊被験者としない。前子癇症妊婦は特殊被験者とする。
- 評価方法の詳細について：従来の両側同時法に代えて日本提案の両側交互法を採用する。

・審議結果を反映した CD を ’07/9 に発行、’07/11 締切りでコメント募集する予定。

(3) 今後の JWG７開催

臨床評価規格(81060-2)CD コメント審議と DIS 案作成：07 年 12 月 3～5 日　場所: タンパ/アメリカ

自動式規格(80601-2-30)DIS コメント審議と FDIS 案作成：'08 年 3 月末～4 月初　場所：深川/中国

臨床評価規格(81060-2)DIS コメント審議と FDIS 案作成：'08 年 12 月 1～5 日　場所：スロベニア

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後 6週間以内 に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後 1 週間以内に事務局に提出して下さい。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／TC80-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日：2007 年 7 月 13 日

（報告者記載）整理番号：H19TC80⑤

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：矢内　崇雅　報告書作成者氏名：　田北　順二　（会社名）日本無線（株）

出席会議名(半角)	区分	組織番号(TC/SC/TA)	TC80(半角)
WG6	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他	名称(日本語)	デジタルインタフェース
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 26 日 ～ 2007 年 6 月 29 日		
開催場所	（国名）スウェーデン	（都市名）ストックホルム	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Mr S. Steier	幹事国　スウェーデン	
参加国及び参加人数	5ヶ国、主な国名 米国、英国、スウェーデン、ノルウェー、日本、参加人数（7）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA電子)] ○田北 順二(日本無線		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

1．背景
船舶搭載機器のデジタルインタフェースに関する規格作成 WG である。

2．目的
舶用機器間のデジタルインタフェースを検討、審議する。5月に開催された TC80 総会での WG6 関連決定事項及び WG14 より緊急に検討依頼のあったＡＩＳ基地局用のインタフェース(PAS 103)等について審議する。

3．成果
1) TC80 総会での審議結果を受けて、イーサーネットによる IEC 61162-4 より簡易なインタフェースを検討することになり、データ内容は、基本的に IEC 61162-1 または-3 の活用を考えることになった。今後、より多くのエキスパートの参加を呼びかけ、検討することになった。
2) IEC 61162-1 Ed3 に追加された NAVTEX 用のセンテンス"NRX"の内容に誤りがあることが判明し、修正内容を示した文書を作成した。WG6　Convenor が TC80 Secretary にレターを送付し、対処を依頼することになった。
3) WG14 より提案されたクラスＡ　AIS PI ポート用 IEC 61162-1 新センテンスの内容を審議し、修正案を作成した。この修正案を WG14 に送付し、内容の再検討を要請することになった。
4) アラート・マネージメント等による新たな通信に対応したメッセージを検討することになり、今後、WG10(INS)と共同して検討を進めることになった。また NMEA2000 規格検討グループがアラート・マネージメントに対応した PGN(Parameter Group Number)を提案しているので、この内容についても検討することになった。
5)今後の WG6 会議は、2007 年 10 月 17 日～20 日、米国、フロリダにて開催、引き続き 2008 年 1 月 22 日～25 日、英国・ロンドン(BSI)での開催が決定した。

以上

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／TC91-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日：2007 年 8 月 4 日

（報告者記載）整理番号：H19TC91①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：西山　和夫　　報告書作成者氏名：西山　和夫　（会社名）ソニー（株）

出席会議名(半角)	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
IEC/TC91 WG's-Mtg.	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	電子実装技術
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 7 日 ～ 2007 年 6 月 8 日		
開催場所	（国名）シンガポール	（都市名）シンガポール	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	D.Bergman （米国）	幹事国　日本	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 米国、英国、ドイツ、オランダ、フィンランド、シンガポール、日本、台湾 参加人数（28）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 山本（テクノオフィスヤマモト）、梅垣（NEC）、春日（NEC エレ）、大島（ニチコン）、気賀（ソニー）、 荒金（ソニー）、坂本（オムロン）、潮（PED）、苅谷（芝浦工大）、干（横浜国大）、○西山（ソニー）、佐藤（JEITA）		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは１行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

１．背景・目的

TC91-WG2、WG3 及び Marking-Pj に関連した集中した審議を行い、IEC 規格文書の日本側意向の反映と日本提案の文書の IEC 規格化への推進を図る。また今回も TC91/WG3 と TC47/WG2 との Joint Mtg.を行い、お互いに関連した規格について意見の調整を行う事で規格の整合を図った。

２．主な成果

２－１）WG-2

・61190-1-2/1-3：日本から提案中の鉛フリーはんだ材料/ペーストの規格改訂について 2007 年 Aprl に IS が発行された。
・61192-5：プリント配線板実装のリワーク規格であるが、91/652/FDIS が承認され、IS が発行された。
・日本提案のボイド評価基準も RVN（Approved）に基づいて CD 案を説明し、各国のコメントを審議して observation を確認した。次回のソウル会議に向けて CD を回覧する。
・新しく導電性樹脂材料の標準化を進めることとし、NP の発行準備を確認した。日本からも提案に参加する。

２－２）WG-3

・電子実装技術における実装後の試験方法として日本から提案していた 60068-2-69 ,60068-2-82 は IS が発行。
・鉛フリーはんだに関する標準化提案も 8 件中 5 件を日本がリーダを担当しているが、各々の進捗を確認した。
接合強度試験方法として 62137-1-1(pull test),1-2(shear test)は FDIS の段階。
62137-1-3(cyclic drop test)も CD が回覧済みで CDV に進める。
1-4(Cyclic bending test)と 1-5(Mechanical shear fatigue test)は RVN 発行済みで CD draft 案の審議と修正を行った。

２－３）TC91/WG3&TC47/WG2 Joint Mtg.

・実装後の半導体部品の信頼性評価試験方法や鉛フリー表示などに関して TC47（半導体）/WG2 との会合を持ち、具体的に実装後の落下試験、ウィスカ試験方法と鉛フリー表示について意見交換と調整を行った。
落下試験でコメントにもあった歪ゲージの取り付け方法を記載する事とし、TC47/WG2 担当者にも送付する事を確認した。
・鉛フリー表示では半導体に限定した鉛フリー表示規格を TC47/WG2 に再提案する事になっていたが、提示されなかった。
・TC91 での鉛フリー表示を含む有害物質の含有・非含有表示は TC111 からクレームがあり、TC111 との調整中であることが潮リーダから報告された。

３．その他

・次回会議　TC91 Plenary Mtg.&WG-Mtg.　2007 年 10 月 15 日～19 日韓国ソウルにて開催予定。

以上

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：3-3／TC91-②（事務局記入）　　様式 4

国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日：2007年 6月 20日

（報告者記載）整理番号：H19TC91①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：西山　和夫　　報告書作成者氏名：春日　壽夫　（会社名）NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)

出席会議名(半角)	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91(半角)
TC91/WG3	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	電子実装技術
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開　催　期　日	2007年 6月 7日 ～ 2007年 6月 8日		
開　催　場　所	（国名）シンガポール	（都市名）シンガポール	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	春日 壽夫	幹事国　日本	
参加国及び参加人数	5ヶ国、主な国名 日本、ドイツ、英国、フィンランド、米国、参加人数（18）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○大島(ニチコン)、○気賀(ソニー)、苅谷(芝浦工大)、荒金(ソニー)、山本(ﾃｸﾉｵﾌｨｽ山本)、坂本(オムロン)、潮(PED)、西山(ソニー：TC91 国際幹事)、松村(タムラ化研)、 ○春日(NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ：WG3 国際ｺﾝﾋﾞﾅ)、佐藤（JEITA）		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

目的：電子実装技術にかかわる実装後の試験方法につき審議している。

成果：

1. IS 発行文書(前回会議以来、発行されたIS/TR が報告された3件中、日本担当2件)

1-1)IEC 60068-2-69 Ed. 2: Solderability of electronic components for surface mount technology by the wetting balance method(リーダ：英国、共同リーダ／日本担当：大島)　2007-05-09

1-2)IEC 60068-2-82 Ed.1: Whisker test methods for electronic and electric components (リーダ゛：坂本) 2007-05-23

1-3)IEC /TR 60068-3-12 Ed.1 Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile(旧# IEC/TR 60068-2-84) 2007-03-12

2.鉛フリーはんだに関する標準化提案（日本担当：8件中5件リーダ、2件共同リーダ）

2-1) Pj# 60068-2-20(リーダ:ドイツ、共同リーダ/日本：大島)：リード付きデバイスのはんだ付け性とはんだ耐熱性試験(91/640/CDV が 06-10-27 に回覧されている。) [CCDV]

・RVC の審議結果 6/8 に国際幹事手渡した。FDIS を 7/15 までに完成予定。

2-2) IEC60068-2-44 改正(リーダ：ドイツ)：はんだ付け試験のガイダンス

・はんだ付け試験のガイダンスのコンセプトを検討（12/31）

・並行して、MCR 発行の手続きを確認しておく。(国際幹事、コンビナ)

2-3) Pj#60068-2-83（リーダ：大島）：SMD のはんだ付け性試験/ソルダペーストを用いる平衡法(91/682/CD) [1CD]

・-2-69 との差を示す比較データを準備する。(12/31 まで、出来れば次回 10 月会議で)。

Pj# 62137-1(リーダ゛:高橋)：接合強度試験方法

2-4) part1(pull test：引っ張り試験): (91/681/FDIS) [CDIS] FDIS 締切り 6/22。

2-5) part2(shear test：せん断試験): (91/683/FDIS) [CDIS] FDIS 締切り 6/22。

2-6) part3(cyclic drop test:落下試験)(リーダ：気賀): 91/614/CD [1CD] 歪ゲージの取り付ける方法の記載 CDV を各メンバに 6/30、国際幹事に 7/31 まで。

2-7) part4(Cyclic bending test:繰り返し曲げ試験 (リーダ：気賀)：(91/637/NP) 91/649A/RVN: [ANW]

・CD draft の修正と国際幹事へ送付（6/8）

2-8) part5(Mechanical shear fatigue test せん断疲労試験) (リーダ：苅谷)：(91/638/NP、91/650A/RVN) [ANW]

・CD draft の修正と国際幹事へ送付（6/8）

３.新規提案の紹介（日本提案2件の NP）

3-1)鉛フリー対応のロードマップ（荒金マップ）最新版を紹介した。
3-2) IEC 60068-2-ｘｘ（リーダ：戸井）：マイグレーション試験方法
・NP 待ちであることが報告された。
・ドイツ NC が次回にマイグレーションに関するデータを紹介することになった。
3-3)TG to study external mechanical stress of whisker Growth among members ことになった（現メンバは；Michael Krapp Walter Huck、Chris Hunt、大島、森内、坂本、気賀）
４．メンテナンスサイクル文書の確認
・メンテナンスサイクルの状況が確認された(IEC 60068-2-20、IEC 60068-2-44、IEC 60068-2-58、IEC 60068-2-77、IEC62137)
5-1) IEC60068-2-58 改正(リーダ：大島)：メンバからコメントを聞いて次回計画を出す
5-2) IEC60068-2-77 見直し(リーダ：土生)：メンバからコメントを聞いて次回計画を出す
5-3) IEC62137 見直し(リーダ：梅垣)：：メンバからコメントを聞いて次回計画を出す／62137-3 の番号にする
６．次回会議
2007 年 10 月 17 日 PM～18 日 AM：韓国（TC91 plenary meeting, October 15 to 19, 2007 in Seoul/Korea）
<予定>IEC 総会に併せて、TC91 と TC47 と同期開催（招待されない場合、開催地は協力して決定する）
2008 年 秋（ブラジル）
2009 年 秋 (イスラエル)
2010 年 秋 米国シアトル →TC47 と TC91 が招待される事は、ほぼ決定

［注］： 1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会 知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル） Tel：03-3518-6435 Fax：03-3295-8727

（社）電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC91-③（事務局記入）　　様式 4

国際標準化対応支援委員会　御中　　提出日：2007 年 6 月 20 日

（報告者記載）整理番号：H19TC91①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：西山和夫　報告書作成者氏名：春日壽夫　（会社名）NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)

出席会議名（半角）	区分	組織番号（TC/SC/TA）	TC91/TC47 （半角）
TC91WG3-TC47WG2	□TC □SC □TA □WG □PT ☒その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称（日本語）	電子実装技術/半導体
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2007 年 6 月 8 日 ～ 200 年 月 日		
開催場所	（国名）シンガポール	（都市名）シンガポール	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	春日壽夫(TC91WG3 コンビナ)	幹事国 日本	
参加国及び参加人数	5 ヶ国、主な国名 日本、米国、英国、ドイツ、フィンランド、参加人数（21 名）		
日本人出席者名（会社名）	［○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)］ ○山本(ﾃｸﾉｵﾌｨｽ山本)、○坂本(オムロン)、于(横浜国大)、苅谷(芝浦工大)、大島(ニチコン)、気賀(ソニー)、荒金(ソニー)、潮(PED)、柴田(JPCA)、池田(日立化成) 、松村(タムラ化研)、西山(ソニー：TC91 国際幹事)、和田(松下電器：TC47WG2)、春日(NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ：WG3 国際ｺﾝﾋﾞﾅ)、佐藤（JEITA）		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

●TC47WG2(半導体信頼性試験方法)と TC91WG3(電子実装試験方法)との合同会議

・5 ヶ国 21 名（TC91WG3:3 ヶ国 15 名、TC47WG2：3 ヶ国 4 名）

・実装後の信頼性評価試験方法および鉛フリーラベル表示等に関して審議している IECTC47WG2 (半導体信頼性)からの申し入れで、重複作業を避けるための情報交換と調整を目的とした合同会議で第 3 回目が開催された。

1)活動紹介：

・前日に開催された両 WG の審議結果が、両コンビナから紹介された。

・TC47WG2:Jim Lynch（英国）、TC91WG3：春日（NECEL）

2)トピックス：

2 つのグループに関連の深いウィスカ試験、ドロップテスト、鉛フリー表示に関する活動状況が紹介された。

①落下試験

・TC47WG2：日本案(TC91 における日本案と同じ)は、CO のミスにより日本の提案が現行 47/1850/CDV(60749-37) に反映されなかったので、60749-40 に番号を変えた CDV からスターとすることを CO と交渉することになっていたが、結局これから 60749-40 の NP を提出することになった。（TC47WG2 の和田氏が 10 月までにご準備することになった）

・TC91WG3:: 91/614/CD[1CD]の CDV draft を 7/31 までに、リーダの気賀氏が準備することになった。コメントで要望のあった歪ゲージの取り付け方法を Annex に記載する原稿が準備でき次第、TC47WG2 の担当(日本国内委員会→JEITA 半導体信頼性小委員会和田氏/松島氏)へ送付する （1 月中旬）

②ウィスカ試験

・TC47WG2：SEMICONDUCTOR ACCEPTANCE DOCUMENT に限定して PAS にする予定（JEDEC 201 が基本）との報告があった。（テスト方法は参照するとのこと）

・TC91WG3: IEC 60068-2-82 Ed.1 (Whisker test methods for electronic and electric components) が、2007-05-23 に発行されたことが報告された旨、リーダの坂本氏から報告があった。

③鉛フリー表示

・TC47WG2：当初の 47/1772/NP が TC91 と重複する事から否決され、前回には半導体に限定した鉛フリー表示規格を TC47WG2 に再提案することになっていたが、提示されなかった。今回は IPC/JEDEC J-std- 609 を PAS (IEC-JEDEC agreement) にすることをリーダの Jack McCullen から紹介があった。

・宣言してきたため、半導体に限定すること(Component ではなく Semiconductor device に限定すること)を申し入れた。

・TC91PT 62468：91/642/CDV に対して TC111 がクレームをつけてきており、TC111 と調整中との報告が潮リーダからなされた。

６．次回会議
今後は暫く１年間ごとに TC91WG3-TC47WG2 合同会議を開催することにした。
（第４回合同会議を、2008 年５月に米国で JIC 開催に合わせるか、ブラジルでの IEC 総会に合わせるかを別途検討することになった）
<構想>IEC 総会に併せて、TC91 と TC47 と同期開催（招待されない場合、開催地は協力して決定する）
2008 年 秋（ブラジル）
2009 年 秋 (イスラエル)
2010 年 秋 米国シアトル →TC47 と TC91 が招待される事は、ほぼ決定

以上

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会 知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル） Tel：03-3518-6435 Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC100/TA5-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日: 2007 年 8 月 7 日

（報告者記載）整理番号：
H19TC100/TA5①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：濵田 靖司　報告書作成者氏名：濵田 靖司　（会社名）日本電気

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC100/TA5 (半角)
PT 60728-13	□ＴＣ　□ＳＣ　□ＴＡ　□ＷＧ　☒ＰＴ　□その他		
	□ＴＣ　□ＳＣ　□ＴＡ　□ＷＧ　□ＰＴ　□その他	名称 (日本語)	ケーブルネットワーク
	□ＴＣ　□ＳＣ　□ＴＡ　□ＷＧ　□ＰＴ　□その他		
	□ＴＣ　□ＳＣ　□ＴＡ　□ＷＧ　□ＰＴ　□その他	☒単独開催　□同時開催	

開催期日	2007 年 7 月 23 日 ～ 2007 年 7 月 24 日	
開催場所	（国名）日本	（都市名）東京
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	日本	幹事国　フィンランド
参加国及び参加人数	2ヶ国、主な国名 日本(8 名)、ドイツ(2 名)、参加人数（10）	
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 松本檀（日本ケーブルラボ）、松本卓三（古河電工）、山浦浩（八木アンテナ）、ラッカパン・バラスブラマニア（シンクレイヤ）、渡辺治雄（東芝）、三尾識（日立）、高田薫（JEITA）、濵田靖司（日本電気）	

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは１行ですが、所定欄に改行しながら最大28 行まで記入できます。）

今年１月にフランクフルトでキックオフを行った日本提案の放送用 FTTH システム（Optical systems for Broadcast Signal Transmission）IS 化プロジェクト PT60728 Part13(コンベナ：日本ケーブルラボ 松本檀氏)に関し、海外メンバを招致し日本にて会議を持った。前述キックオフの後、国内関係者(JEITA ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ標準化専門委員会 CATV 対応 Group)により、

・システム記述と測定法記述を一つのドキュメントとして集約
・光システムとしての規定を主眼とした記載（機器単体の性能／測定法規定は既存 IS を引用）
・既存 IS（Part1(下りシステム性能)、Part 6（光機器）、TC87 関係）との記述整合性

等のブラッシュアップを図り、事前配布した。それに対するイタリアメンバからの修正提案(主にエディトリアルな内容)があり、今回会議ではそれをベースにしての内容審議となった。

２日に亘る詳細内容の審議の結果、20 数項目のアクションアイテム(テクニカル内容の調査、エディトリアル修正等)を抽出した。尚、会議後、審議中に修正した箇所を反映させたドキュメントを PT-13 TYO WD-01 rev.1 として関係者へ配布した。

10 月開催予定の TC100／TA5 の全体会議にて、経過報告および今回の結果を踏まえた継続審議を行う予定。

[注]： 1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.7)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号： 3-3／TC110-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中

提出日：2007 年 6 月 26 日

（報告者記載）整理番号：
H19TC110①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：　森本光孝　　報告書作成者氏名：　石黒勝己　（会社名）シャープ株式会社

出席会議名（半角）	区　分		組織番号 (TC/SC/TA)	TC110/WG2（半角）
TC110/WG2	☐ＴＣ　☐ＳＣ　☐ＴＡ　☒ＷＧ　☐ＰＴ　☐その他			
	☐ＴＣ　☐ＳＣ　☐ＴＡ　☐ＷＧ　☐ＰＴ　☐その他		名　称 (日本語)	フラットパネルディスプレイ/ 液晶ディスプレイ
	☐ＴＣ　☐ＳＣ　☐ＴＡ　☐ＷＧ　☐ＰＴ　☐その他			
	☐ＴＣ　☐ＳＣ　☐ＴＡ　☐ＷＧ　☐ＰＴ　☐その他		☒単独開催　☐同時開催	
開　催　期　日	2007 年 5 月 25 日 ～　2007 年 5 月 27 日			
開　催　場　所	（国名）米国	（都市名）ロングビーチ		
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	石黒勝己	幹事国　日本		
参　加　国及び 参　加　人　数	8ヶ国、主な国名 日本、韓国、中国、米国、オランダ、ドイツ、参加人数（17）			
日　本　人 出席者名（会社名）	[○：補助対象者・・・（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○石黒勝己（シャープ）、○森本光孝（NEC）、芝原嘉彦（富士フイルム）、岡村（コーニングインターナショナル）			

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

1．背景・目的等

今年１回目の液晶グループの会議であり、SID'07 の会期の後に開催された。

IEC 61747 "Liquid crystal display devices"シリーズの４件のプロジェクトにつき、昨年 12 月の大津会議での審議結果を反映したドキュメントの審議を進めるのが目的。今 2007 年度から JEITA／ディスプレイデバイス部会の傘下となったディスプレイデバイス標準化専門委員会／液晶ディスプレイグループ（国内審議団体）で審議した日本意見を反映するために参加した。

2．成果

IEC 61747 シリーズの以下４プロジェクトにつき、ドキュメント審議を実施した。

・61747-6-2 "Measuring method for LCD modules - Reflective type"
各国からのコメントを審議、その結果を反映して次回会議までに文書を発行する。6 月末には幹事宛に送付の予定。
日本からの「測定誤差要因に関する考察」の Annex 化の提案は当面盛り込まないこととなった。公表された文献でないため、テクニカルレポート化など、再検討を要す。

・61747-5-2 "Visual inspection of active matrix LCD modules"
大津会議の結果を反映した 2nd CD の回付が遅れていたため、ロングビーチでの審議結果も反映した文書を６月初旬には幹事宛に送付、2nd CD 化する。

・61747-6-3 "Motion artifact measurement of active matrix LCD modules"
2nd CD の回付遅れ、ロングビーチでの審議結果を反映した文書を７月第１週に幹事宛に送付、2nd CD 化する。

・61747-5-3 "Glass strength and reliability measurement method"
PAS として中央事務局に送付済、CDV とするため仏訳をフランス NC に依頼中であることを確認。

3．その他、問題点等

次回は９月 3～5 日、TC110 の開催に合わせて中国・広州での開催を予定。

[注]： 1．該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2．本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3．WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4．報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5．この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準・安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号：3-3／TC110-②（事務局記入）

国際標準化対応支援委員会　御中　　　提出日: 2007 年 6 月 29 日

（報告者記載）整理番号：H19TC110②

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：森本光孝　報告書作成者氏名：安藤　亨　（会社名）松下電器産業株式会社

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC100/WG4 (半角)
TC110/WG4	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他	名称 (日本語)	フラットパネルディスプレイ／プラズマディスプレイ
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 5 月 26 日 ～ 2007 年 5 月 27 日		
開催場所	(国名) 米国	(都市名) ロングビーチ	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	篠田　傳	幹事国　日本	
参加国及び参加人数	6ヶ国、主な国名 日本、韓国、中国、米国、オランダ、フランス、参加人数（16）		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○篠田　傳(広島大学)、池田あゆみ(エスペック)、○安藤　亨(松下電器産業、田中宏典(松下電器産業)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

＜背景・目的＞

IEC/TC110/WG4 会議は、2006 年 12 月（大津）に続く会議となる。審議中規格およびテーマは以下の通りである。
①Electrical Interface ②Measuring methods - Quality ③Measuring methods - Visual Quality ④ Terminology (maintenance) ⑤Measuring methods - optical and optoelectrical (maintenance) ⑥IEC/TC100 との joint working (MT62087, TV power consumption)

JEITA／ディスプレイデバイス標準化専門委員会／プラズマディスプレイグループの IEC 対応プロジェクトで検討してきた素案をできるだけ多く反映させる形で進める。その他プラズマディスプレイ業界の直面する状況についてディスカッションを行う。

＜成果＞

①および②について、事前に打土井委員（今回欠席）が中心となって日本でとりまとめたコメントを提示し、合意を得ることができた。

③のうち"image streaking"測定法については、日本で審議した結果のとおり、高負荷と低負荷の２種類のパターンを組み込むこととなった。また"moving picture resolution"については安藤委員のリードにより審議を進め、いくつかの技術的課題について合意を得ることができた。

⑥については、MT62087 のプロジェクトに日本からは打土井委員と安藤委員が参加しており、CD 発行に到達した。WG4 会議では、このプロジェクトおよび世界各国における消費電力測定法にからむ問題の情報交換を行った。

さらに、TC110 の Horizontal Hamonization（横串）プロジェクトの具体的アクションの提案があり、議論が進められることとなった。プロジェクトを推進するメンバーの WG4 代表の一人として、池田委員が選出された。

＜問題点＞

・平均消費電力の測定法が現在ないことから、不適切な測定法による消費電力値を用いて欧州で不当なプラズマ TV のバッシングが行われている事例が紹介され、TC100 のプロジェクトでとりまとめた動画信号を用いた平均電力を積極的に各国で活用するよう意見交換がなされた。

・SID 傘下に元 VESA の測定法委員会メンバーが組織を設立、標準化活動を開始したことが紹介された。IEC とはスタンスが大きく異なるため、混乱をさせないか、注意する。また、デバイスによらない試験法を定めようとしているにもかかわらずプラズマディスプレイの専門家がいないという点もあり、今後の動向をフォローしていくこととなった。

＜その他＞　次回の会議は 2007 年９月に中国・広州にて開催予定である。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後「6週間以内」に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号：3-3／TC110-③（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　　　提出日：2007 年 6 月 29 日

（報告者記載）整理番号：H19TC110③

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：森本光孝　報告書作成者氏名：浅井伸利　（会社名）ソニー株式会社

出席会議名(半角)	区　分		
TC110/WG5	☐ＴＣ ☐ＳＣ ☐ＴＡ ☒ＷＧ ☐ＰＴ ☐その他	組織番号 (TC/SC/TA)	TC110/WG5 (半角)
	☐ＴＣ ☐ＳＣ ☐ＴＡ ☐ＷＧ ☐ＰＴ ☐その他	名　称 (日本語)	フラットパネルディスプレイ/有機 EL ディスプレイ
	☐ＴＣ ☐ＳＣ ☐ＴＡ ☐ＷＧ ☐ＰＴ ☐その他		
	☐ＴＣ ☐ＳＣ ☐ＴＡ ☐ＷＧ ☐ＰＴ ☐その他	☒単独開催 ☐同時開催	
開催期日	2007 年 5 月 25 日 ～ 2007 年 5 月 27 日		
開催場所	（国名）米国	（都市名）ロングビーチ	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Prof. Changhee Lee (convenor)	幹事国　日本	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 日本、米国、韓国、中国、フィンランド、英国、ドイツ、参加人数（16）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○池田あゆみ(エスペック)、前川雄一(コダック)、○浅井伸利(ソニー)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

【背景・目的】WG5 では４つ標準化 PJ(①Generic Specifications, ②Terminology and Letter Symbols, ③Measuring Methods of Electronics and Optoelectronics, ④Environmental test methods が進行中、さらに、⑤Measuring Methods of Visual Quality を予備調査している。①、②はほぼ終了段階にある。③はまだ CDV 前で、大幅に遅れ気味、④も１CD の審議段階、⑤もプレスタディとはいえ、かなり高度なテーマであり、活発な審議で PJ の進捗を加速するため開会した。

【成果】①については CDV が賛成採択、②については FDIS ドラフト提出完了という現状を確認した。③については、明室コントラスト測定法と発光効率測定法をこの PJ から除くことに合意し、早期に CDV ドラフトを作成・提出することにした。④については、提出された１CD の内容を審議した。環境試験の測定時間と環境条件の範囲について、合意に達せず、耐久試験的な側面の各国での認識の差がみられた。他、曖昧な定義をの各国共通に明確化を図る必要性があり、継続審議とした。⑤この PJ に、③測定法 PJ から切り離した明室コントラストと発光効率測定法を加えることが合意された。NP 提案する時期については決定されず、しばらく予備調査を続けることになった。焼きつき状態の測定法・測定条件、コントラストなどの画質評価を CIECAM02 での色空間座標で再現色範囲で表現する、OLED に適用すべき動画画質評価法について、寿命の評価法などの調査状況が報告された。　さらに、新しい PJ として⑥Mechanical test method の提案と予備調査状況の報告があったが、NP 提案は③測定法の CDV が採択された後に行うことが決まった。

また、FPD 間での標準化の共通化を図るため、Horizanntal Harmonization Group（HHG）が新設されたが、そのメンバーに２名(USA,Finland)選出。PJ ドラフトの最終チェックのため英語国メンバを２名選出。

次回は、9 月 3―5 日、広州（中国）での TC110 会議に合わせて開催、翌年 1-2 月にアドホック会議を Santa Barbara(US)で開催を予定。

【問題点】④環境試験に関しては、各国間で捕らえ方や関心度の差があり、この差を埋めていくことが重要である。⑤は項目が過多で、内容も複雑で議論がまとまらない可能性もある。合意できる部分から NP 化すること考慮すべき。国内審議担当の有機 EL-G では、JEITA 規格として測定法 PrtⅡの調査を進めているが、④,⑤の内容にリンクした審議を進め、日本の提案を IEC 規格に出来るだけ反映させてゆく。

また、国際会議での積極的な活動が益々必要になっており、そのためにも、出張費補助等の一層の充実が必要である。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6 週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後 1 週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

国際標準化対応支援委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　知的基盤部標準･安全グループ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル）　Tel：03-3518-6435　Fax：03-3295-8727

(TSC-06 様式 2007.5)

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　運営委員会・資料番号：3-3／SC31-①（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　　　　　提出日: 2007年7月17日

（報告者記載）整理番号：H19SC31①

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名:　本田　邦夫　　報告書作成者氏名：　小橋　一夫　（会社名）JEITA

出席会議名(半角)	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC31 (半角)
SC31	□TC ☒SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	自動認識及びデータ取得技術
SC31/WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
SC31/WG4	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
SC31/WG4/SG5	□TC □SC □TA □WG □PT ☒その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2007年6月6日 ～ 2007年6月8日		
開催場所	（国名）南アフリカ	（都市名）プレトリア	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	SC31:Chack Biss、WG2/吉岡稔弘、他	幹事国　米国	
参加国及び参加人数	16ヶ国、主な国名 米国、カナダ、ドイツ、英国、韓国、中国、オーストリア、参加人数（48）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 遠藤良樹(METI)、○小橋一夫(JEITA)、柴田彰(デンソーW)、吉岡稔弘(AI 総研)、渡辺淳(デンソーW)、本澤純(日立)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

1．SC31

・SC31の今回の最大の審議事項は、モバイルRFIDを検討するAdhoc会議の設定であった。これまでの産業界での利用から1歩進み、一般消費者が携帯電話などに組み込まれたRFIDリーダを用いて、身の回りにあるRFIDからデータを読取りユビキタスなネットワークを介して関連情報を入手可能となるサービス環境に対応した新たな技術規格の検討を進めるものである。この課題提起は、韓国から行われ、米国が強力にバックアップしている。第1回のAdhoc会議は10月に韓国で開催されることが決まっており、日本ではQRコードを用いた同種のサービスが既に浸透していることも踏まえ、緊急な対応が必要である。

2．SC31/WG2

・SC31/WG2では、RFIDとそれ以外のAIDCメディア間に生じてきているデータ構造の違いを統一化することを今後の検討課題とするよう、日本から提起した。WG2での賛同を得、SC31の決議にも盛り込まれた。今後NP提案、ワーキングドラフトの起案等多くの作業発生への主導的対応が必要である。

3．WG4

・RFIDのエアーインタフェース規格が、全種類改訂中である。これは、初期のパッシブタイプから、アクティブタイプのRFIDおよびセンサー機能対応のためである。また、18000-6 タイプCに関しても、EPCグローバルの修正検討に沿って改訂が進められている。

・ソフトウェア関連では、ISO/IEC 24791「ソフトウェアシステム基盤」の開発が進行中であるが、従来のアプリケーションコマンド等の規格（ISO/IEC 15961、15962）の改訂も含め、EPCグローバルが進めている規格との整合性を考慮するため、審議に遅れが生じてきている。
日本は、24791のパート２「データマネージメント」のドラフトをCo-chairとして担当しており、この部分の早急なドラフト作成と、各国の賛同の取り付けが重要課題である。

4．WG4/SG5

・3パートからなるISO/IEC 24729の第3パートが遅れている。また、SecurityとSaftyに関するAdhocを構築したが会議が開催されず、今回の会議で、日本からSecurityを要求されているアプリケーションの実例を紹介することで審議の活性化を促した。

[注]： 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WGがTC/SC/TAと同時開催の場合は、WG会議内容はTC/SC報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会　　　　運営委員会・資料番号：3-3／SC31-②（事務局記入）
国際標準化対応支援委員会　御中　　　　　　　　　　　　提出日：2007 年 8 月 7 日

（報告者記載）整理番号：H19SC31②

国際会議出席報告書

国際会議担当委員名：　本田　邦夫　　報告書作成者氏名：　小橋　一夫　（会社名）JEITA

出席会議名（半角）	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC31（半角）
SC31/WG4/SG1	□TC □SC □TA □WG □PT ☒その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称（日本語）	自動認識及びデータ取得技術
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2007 年 7 月 18 日 ～ 2007 年 7 月 20 日		
開催場所	（国名）日本	（都市名）葉山町	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Rick Schuessler	幹事国　（米国）	
参加国及び参加人数	4ヶ国、主な国名 米国、英国、韓国、日本、参加人数（17）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者・・・（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 澤田喜久三(吉川RF)、江原正樹(東京工科大)、渡辺淳(デンソーW)、吉岡稔弘(AI 総研)、菅野博靖(富士通、柴田彰(デンソーW)、寺浦信之(デンソーW)、小橋一夫(JEITA)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

１．概要

今回は、ISO/IEC24791（ソフトウェアシステムインフラストラクチャ）の WD 審議、ISO/IEC15962 と 15961 の改定の WD 審議、及び ISO/IEC24753（センサー情報）の審議が行われた。

２．内容

(1) ISO/IEC24791（ソフトウェアシステムインフラストラクチャ）

・パート 1(アーキテクチャ)についての議論がなされた。内容は事前にアドホックグループで検討され、会議向けに配布された WD の REV0.4 版に基づいて行われた。
基本的には、アドホックのドラフトは了承された。ただ、センサー情報を 24791 でユーザ情報の一つとして扱うのかについてが議論となった。WD にはセンサーデータも 24791 の範囲として記載されているが、センサー情報は 24793 と 15961 で 24791 とは別に扱うという議論があった。結論はでていない。

・また、24791-4（アプリケーションインタフェース）が、現状の WD では、実質的には含まれていないが、これが、必要かどうかの議論がなされた。韓国の Park 氏は必要との意見。
但し、パート４は現状プロジェクトエディタがおらず、WD も無い状態であり、内容が明確になっていない。

・日本からは、パート２に関して、平成 18 年度実施した、RFID]ミドルウェアの開発内容の発表及びデモンストレーションを行った。タグデータプロファイル方式の仕様に関しての活発な質問があり、仕様についての理解が SG1 委員の間で相当深まった。WD にもっと詳細な仕様の説明の追加を求められた。

(2) ISO/IEC 15962/15961

・15962 の改定の WD が Paul より、会議直前に配布され、それについての議論がなされた。

・データコンパクション方式だけでなく、18000-6C 用のアプリケーションコマンド（以前は 15961-1 で規定）を 15962 にもってきているが、これについての基本的なコンセンサスは得られなかった。また、15961-1 の WD も事前配布されていたが、このパートからは、アプリケーションコマンドの詳細は除去されていた。

(3)ISO/IEC 24793

・IEEE1451.7 の活動報告が主になされた。1451.7 でも RFID のアクティブタグを想定した規格化が進んでいる。
24793 とはリエゾン関係にあり、両方の規格化のシンクロナイズの必要性が議論された。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後［6週間以内］に国際会議担当委員経由で、国際標準化対応支援委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に 2 名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「国際標準化対応支援委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。